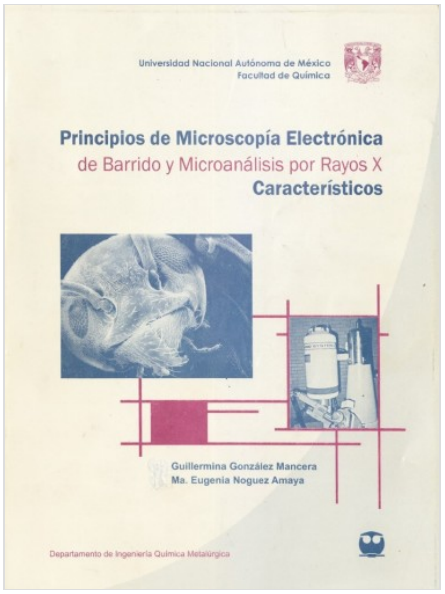
Principios de microscopía electrónica de barrido y microanálisis por rayos X característicos



Autor

Guillermina González Mancera y María Eugenia Noguez Amaya

Sinopsis

El microscopio electrónico de barrido (SEM) por su capacidad para proporcionar información morfológica, topográfica, química, cristalográfica, eléctrica y magnética de muestras másicas, ha contribuido considerablemente al dominio de la Física del estado sólido, de la ciencia de materiales, de la electrónica, de los polímeros, de los textiles, de la Biología, Medicina y cirugía dental, etc.

GN

Sobre el autor

Guillermina González Mancera y María Eugenia Noguez Amaya

E-Book

Año de publicación: 2023

Presentación: EPUB (Digital: descarga y online)

Tamaño: 4.5 Megabytes (MB)

ISBN13: 9786073080866

$20 MXN

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen



Palabras clave

Química; Microscopía electrónica de barrido; Sem; Microanálisis; Rayos x característicos; Morfología; Topografía; Análisis químico; Análisis cristalográfico; Características eléctricas; Características magnéticas; Técnicas físicas; Análisis científico

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen